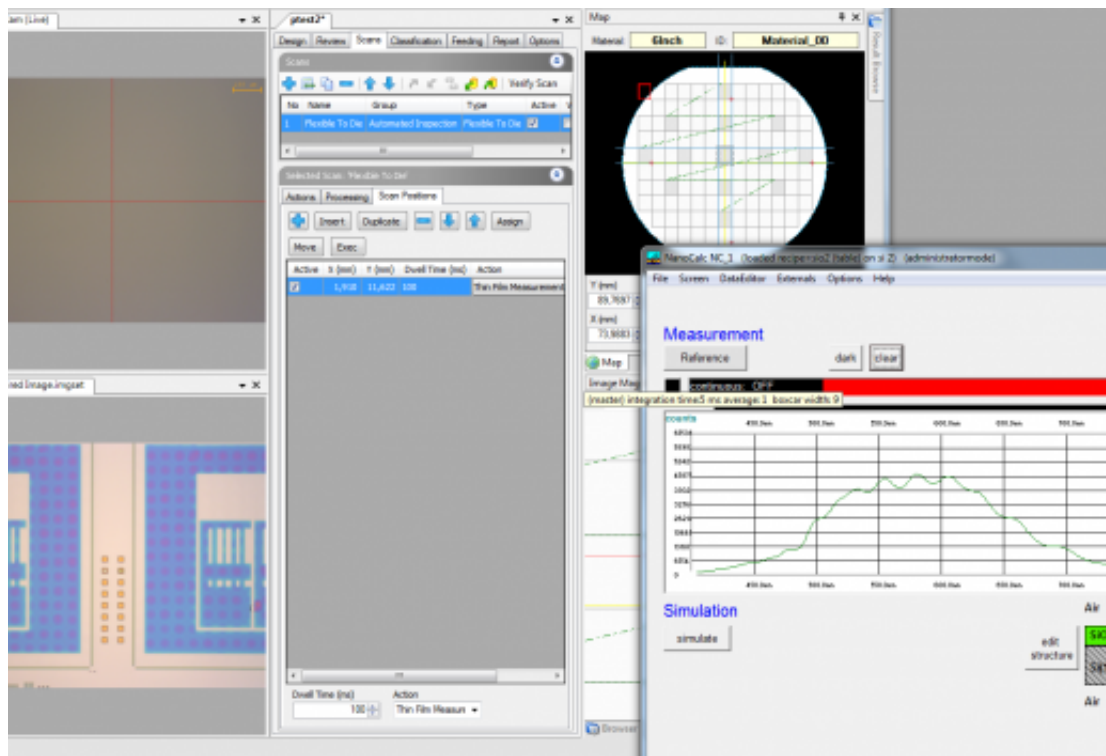
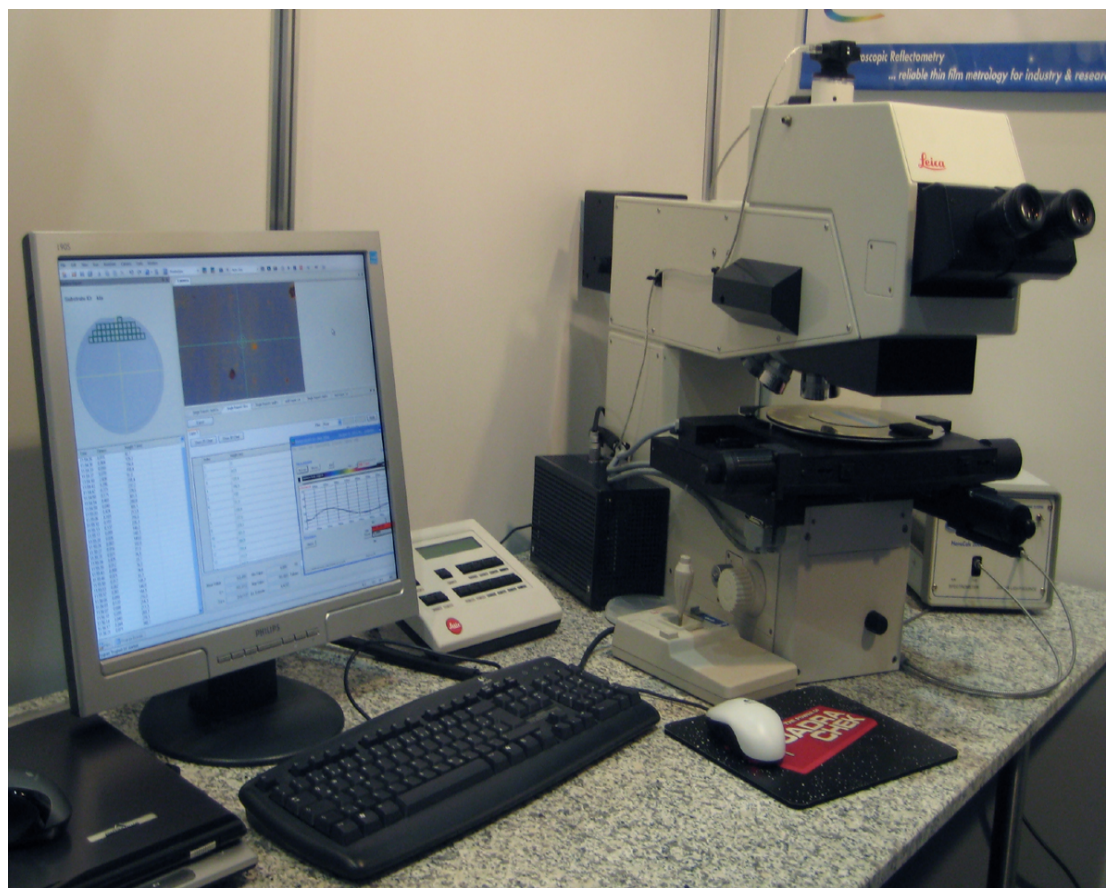


# Schichtdickenmessung (Thin Film Measurement)

## Mikroskop zur Schichtdickenmessung



Leistungsfähiges System für Schichtdicken zwischen 50 nm und ca. 50 µm.



## Halbleiterfertigung:

- Fotolack
- Oxide
- Nitride

## Flüssigkristall-Displays:

- Zellabstände
- Polyimide
- ITO

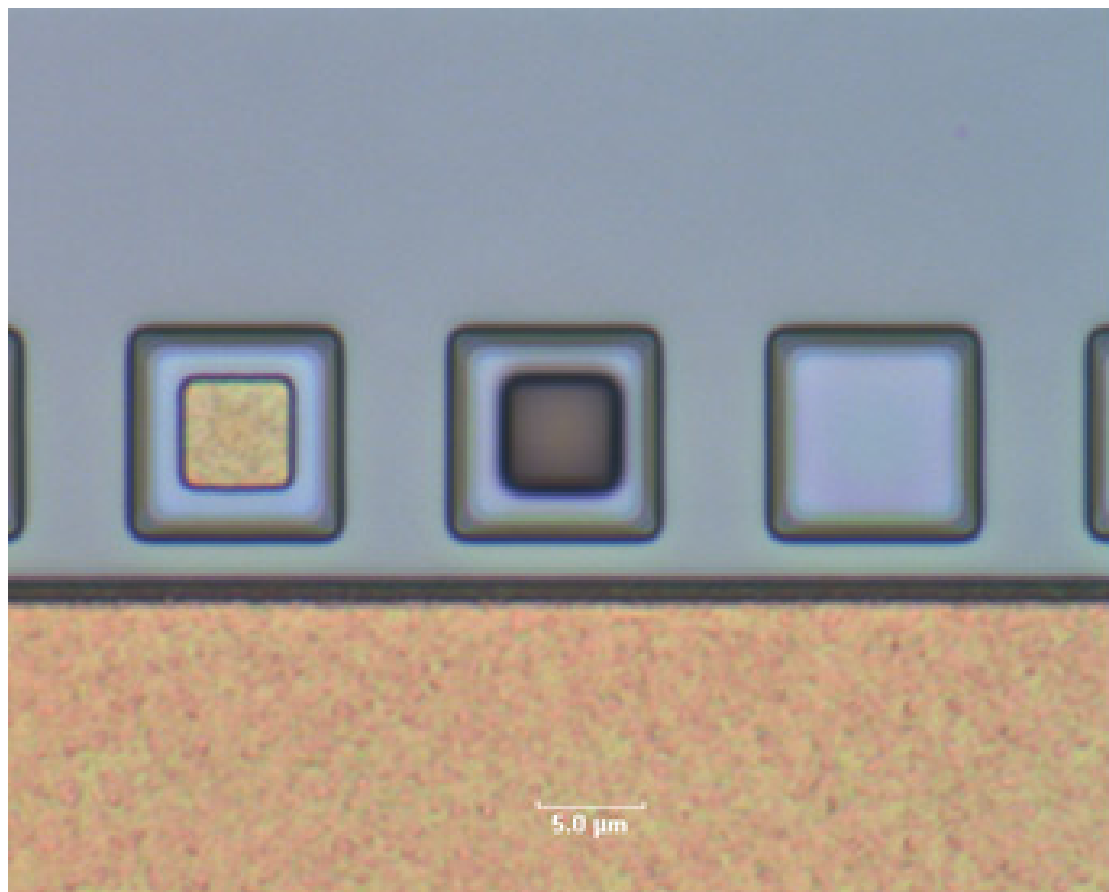
## Optische Beschichtungen:

- Härtebeschichtungen
- Antireflexionsbeschichtungen
- Filter

## Promicron DM12000-TF



Universelles Halbleiter-Mikroskop mit der Option zur Schichtdickenmessung.



**Anfrage**